ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Д. т. н. А. А. АЩЕУЛОВ

Украина, г. Черновцы, Институт термоэлектричества E-mail: AshcheulovAA@rambler.ru

Дата поступления в редакцию 25.11 2008 г. Оппонент д. т. н. Э. М. ШЕР (ФТИ им. А. Ф. Иоффе, г. С.-Петербург)

БЕСКОНТАКТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Метод основан на определении потерь электрической мощности при возникновении вихревых токов в образце, помещенном в зазор сердечника катушки индуктивности, которую питает асимметричный ток.

Одним из основных параметров термоэлектрических материалов, наряду с коэффициентом термо-эдс, электропроводностью и теплопроводностью, является его эффективность [1]. В настоящее время известно достаточное количество методов ее определения [2, 3], в том числе и с помощью измерения электропроводности термоэлектрического образца в изотермических и адиабатических условиях [4, 5]. Однако следует отметить, что наличие на образцах электрических контактов ведет к повышению погрешности и некоторым неудобствам.

Исследования возможностей вихретокового бесконтактного метода контроля электропроводности термоэлектрических материалов [6, 7] показали его перспективность. Целью настоящей работы является изучение физических особенностей такого метода.

В его основу положены физические эффекты взаимодействия электромагнитных полей с исследуемым веществом. Как известно [5], электрическая добротность Q_1 колебательного контура с индуктивностью Lи активным сопротивлением R представляется с помощью распределенных параметров следующим образом:

$$Q_1 = \frac{\omega L}{R} = \frac{\omega L I^2}{R I^2} = \frac{P_p}{P_a},\tag{1}$$

где — круговая частота электрических колебаний контура; *I* — сила тока в нем;

- $P_{\rm p}$ реактивная мощность;
- P_{a}^{p} мощность активных потерь в контуре.

При внесении в этот контур образца термоэлектрического материала (см. **рисунок**) мощность вносимых им активных электрических потерь P_{ao} добавляется к мощности активных потерь в контуре. В этом случае электрическая добротность контура с образцом определяется как

Автор выражает искреннюю признательность И. А. Бучковскому и Д. Д. Величуку за полезные дискуссии и обсуждение полученных результатов.

$$Q_2 = \frac{P_{\rm p}}{P_{\rm a} + P_{\rm ao}}.$$

Выражение для мощности электрических потерь, вносимых в контур этим образцом, имеет следующий вид:

$$P_{\rm ao} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1 Q_2} P_{\rm p}.$$
 (3)

В общем случае, эти потери соответствуют электрической мощности, выделяемой в объеме термоэлектрического образца при циркуляции индуктированных токов Фуко, и вызваны, в основном, известными эффектами Джоуля и Пельтье.

При прохождении через измерительный колебательный контур электрического тока вида

$I_1(t) = 0.5I_{\max}[1 + \operatorname{sign}(\sin 2\pi F t)]\sin 2\pi f t,$

где I_{тах} — максимальное значение синусоидального тока;

F и*f* — частота колебаний импульсов следования и модуляции тока, соответственно,



Слема колеоательного контура с образцом.
 1 — обмотка катушки индуктивности; 2 — тороидальное ферритовое кольцо; 3 — контролируемый образец

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

в объеме образца радиуса *r* индуктируется вихревой электрический ток Фуко плотностью *j*_Ф, представляемый следующим выражением:

$$j_{\Phi} = \sigma_{c}E = \frac{\sigma_{c}}{2\pi r} \frac{d}{dt} \int_{S} BdS =$$
$$= \frac{\sigma_{c}}{2\pi r} \frac{d}{dt} \int_{S} \mu H_{m} [1 + \operatorname{sign}(\sin 2\pi Ft)] \sin 2\pi ft \, dS, \qquad (4)$$

где $\sigma_{\rm c}$ — усредненная для переменного тока электропроводность материала образца;

- Е напряженность электрического поля;
- В индукция магнитного поля в зазоре ферритового сердечника;
- *S* площадь сечения сердечника;
- $\mu-$ магнитная проницаемость материала сердечника;
- *H_m* напряженность магнитного поля.

Плотность теплового потока, вызванного эффектом Джоуля, в некоторой точке с координатами (x_0, y_0, z_0) равна

$$q_{\rm cpДx}(x_0, y_0, z_0) = \frac{\omega LI^2}{\pi R_{s\phi}^2} \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1 Q_2} = j_{\rm cp\Phi}^2(x_0, y_0, z_0) \sigma_{\rm c}^{-1},$$
(5)

где $R_{
m y\hat{o}}$ — эффективный радиус действия магнитного поля;

*j*_{срФ} плотность тока Фуко в точке с координатами (*x*₀, *y*₀, *z*₀), принадлежащей одной из торцевых граней образца, расположеного в начале лабораторной системы координат *XYZ*.

Тепловые потери, вызванные эффектом Пельтье, а следовательно, и осевой градиент температуры в этом

случае отсутствуют:
$$\frac{\partial T}{\partial z} = 0.$$

Усредненное значение электропроводности материала образца равно

$$\sigma_{\rm c} = c \frac{Q_{\rm l} - Q_{\rm 2}}{Q_{\rm l} Q_{\rm 2} d \left(1 + 4 \ln \frac{R_{\rm rop}}{R_{\rm sp}} \right)},\tag{6}$$

$$c = \frac{\pi \omega \mu_0 (\mu'_{\rm n})^2 R_{\rm sol} l_{\rm cp}}{8 \mu'_{\rm \phi} S},\tag{7}$$

где Q_1, Q_2 — электрическая добротность контура без образца и с образцом, соответственно;

- *d* и R_{тор} ширина зазора и средний радиус кольцевого датчика, соответственно;
 - совая частота измерительного колебательного контура;
- μ'_{φ} и ${\mu'}_{\pi}$ динамические магнитные проницаемости материала образца и ферритового сердечника контура, соответственно;
 - S площадь его сечения;
 - $l_{\rm cp}$ средняя длина магнитной силовой линии.

Асимметричный электрический ток I2, имеющий вид

$$I_2(t) = 0.5I_{\max}[1 - \operatorname{sign}(\sin 2\pi F t)][(1 - z / z_0) + \sin 2\pi f t],$$

обуславливает возникновение в зазоре сердечника магнитного поля с индукцией, состоящей из суммы

переменной (синусоидальной) и постоянной составляющих магнитного поля. Переменная составляющая $B_1(t)$ индуктирует в образце токи Фуко, каждое из направлений которого характеризуется собственной магнитной индукцией (± $\Delta B'$), взаимодействующей далее с постоянной составляющей B_0 индукции внешнего магнитного поля.

При положительном направлении тока Фуко эти составляющие суммируются ($B_1 = B_0 + \Delta B'$), при отрицательном — вычитаются ($B_2 = B_0 - \Delta B'$). Это ведет к пространственно-временному перераспределению носителей зарядов в объеме термоэлектрического образца. Магнитная индукция разных направлений вызывает протекание токов Фуко разной полярности на противоположных торцевых гранях образца. Такое зональное расслоение токов Фуко ведет к соответствующему объемному перераспределению выделения разнонаправленных потоков тепла Пельтье $q_{\rm cpfI}$. Значение плотности теплового потока в точке (x_0, y_0, z_0) в этом случае равно

$$q_{\rm cp}(x_0, y_0, z_0) = q_{\rm cp,Ix}(x_0, y_0, z_0) + q_{\rm cp,II}(x_0, y_0, z_0).$$
 (8)

При этом плотность теплового потока представляется выражением

$$q_{\rm cp\Pi}(x_0, y_0, z_0) = \frac{\omega L I_2^2}{\pi R_{3\phi}^2} \frac{Q_2 - Q_3}{Q_2 Q_3},$$
(9)

а усредненное значение электропроводности материала контролируемого образца равно

$$\sigma_{a} = c \frac{Q_{1} - Q_{3}}{Q_{1}Q_{3}d(1 + 4\ln\frac{R_{rop}}{R_{s\phi}})},$$
(10)

где Q_3 — электрическая добротность контура с образцом в случае асимметричного периодического тока.

Таким образом, асимметричный характер тока I_2 колебательного контура вызывает тепловые потери, обусловленные как эффектом Джоуля, так и эффектом Пельтье, причем их соотношение определяется величиной плотности вихревых токов Фуко j_{ϕ} и термоэлектрическими параметрами материала образца. Если значение плотности тока Фуко $j_{cp\Phi}$, протекающего в некоторой точке образца с координатами (x_0, y_0, z_0) , принадлежащей интервалу $(0 < r \le R_{3\phi})$, ограничено условием $0 < j_{cp\Phi} \le j_0$ (например $j_{cp\Phi} = \alpha_{cp}\sigma_a$), то это ведет к выполнению неравенства

 $q_{\rm cpДж}(x_0, y_0, z_0) << q_{\rm cp\Pi}(x_0, y_0, z_0).$

В этом случае осевой градиент температуры в об-

разце не равен нулю $\left(\frac{\partial T}{\partial z} \neq 0\right)$, что обуславливает

появление вдоль его толщины δ разности температуры

$$\Delta T(x_0, y_0, z_0) = \frac{\chi}{\delta} q_{\rm cpII}(x_0, y_0, z_0),$$
(11)

состоящей из суммы | где χ — теплопроводность материала образца. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2009, № 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Известно [1], что удельная мощность Пельтье, выделяемая в единице объема термоэлектрического материала, равна

$$q_{\rm ya\Pi} = \alpha_{\rm cp} \, jT, \tag{12}$$

а ее приведенное значение для нашего случая с учетом (11) составляет

$$q_{\rm cpII}(x_0, y_0, z_0) = \frac{\alpha^2 \sigma_{\rm a} T \Delta T}{\delta} = \frac{\omega L I^2}{\pi R_{\rm sp}^2} \frac{Q_2 - Q_3}{Q_2 Q_3}.$$
 (13)

Усредненное значение коэффициента термо-эдс находим как

$$\alpha_{\rm cp} = \sqrt{\frac{\chi_{\rm cp}}{\sigma_{\rm a} T}},\tag{14}$$

где χ_{cp} — усредненное значение коэффициента теплопроводности материала образца.

С другой стороны, из [1] имеем

$$\alpha_{\rm cp} = \sqrt{\frac{Z_{\rm cp}\chi_{\rm cp}}{\sigma_{\rm c}}},\tag{15}$$

где Z_{ср} — коэффициент термоэлектрической эффективности материала образца.

Приравняв (14) и (15), с учетом (6), (7) и (10) получим выражение для термоэлектрической эффективности:

$$Z_{\rm cp} = \frac{\sigma_{\rm c}}{\sigma_{\rm a}} \frac{1}{T} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1 - Q_3} \frac{Q_3}{Q_2} \frac{1}{T}.$$
(17)

Таким образом, в рамках принятых допущений, вихретоковый метод позволяет бесконтактно определять эффективность термоэлектрических материалов [8]. Исследования образцов на основе кристаллов твердых растворов Bi–Te–Se–Sb, проведенные на соответствующим образом модифицированной установке [6, 7] с использованием вихретоковых датчиков [9, 10], подтверждают эти выводы. Численные оценки погрешности показывают, что она не превышает 1%.

Конкретные методики определения термоэлектрический добротности Z для случаев термоэлектрически изотропных и анизотропных, а также периодически неоднородных структур и функционально-градиентных материалов будут представлены в последующих публикациях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Иоффе А. Ф. Полупроводниковые термоэлементы.— М.-Л.: Изд. АН СССР, 1960.

2. Harman T. C., Cahn J. H., Loganm J. Measurement of thermal conductivity by utivization of Peltier effect // J. Appl. Phys.— 1950.— Vol. 30, N 9.— P. 1351—1359.

3. Павлов Л. П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов.— М.: Высш. школа, 1987.

4. Вайнер А. Л. Термоэлектрические параметры и их измерение.— Одесса: Студия "Негоциант", 1998.

5. Сурин Ю. В., Шимко В. И., Матвеев В. В. Бесконтактный метод измерения удельного сопротивления пластин полупроводников и эпитаксиальных слоев // Заводская лаборатория.— 1966.— Т. 32, № 9.— С. 1086—1088.

6. Ащеулов А. А., Бучковский И. А., Романюк И. С. Устройство для бесконтактного измерения электропроводности полупроводников // ТКЭА.— 2007.— № 2.— С. 55—57.

7. Ащеулов А. А., Бучковский И. А., Величук Д. Д., Романюк И. С. Бесконтактный измеритель электропроводности термоэлектрических материалов. // Сенсорная электроника и микросистемные технологии.— 2008.— № 1.— С. 38—43.

8. Пат. 29213 України. Процес визначення добротності термоелектричних матеріалів / А. А. Ащеулов, І. А. Бучковський, Д. Д. Величук.— 2008.— Бюл. № 1.

9. Пат. 32279 україни. Датчик для безконтактного вимірювача електропровідності термоелектричних матеріалів / А. А. Ащеулов, І. А. Бучковский.— 2008.— Бюл. № 9.

10. Ащеулов А. А., Бучковский И. А., Величук Д. Д., Романюк И. С. Автогенераторные датчики электропроводности // Материалы НПК «Сенсор-2008».— Одесса.— 2008.— С. 12.

